



DEUTSCHES
PATENTAMT

21 Aktenzeichen: 196 28 156.3
22 Anmeldetag: 12. 7. 96
43 Offenlegungstag: 15. 1. 98

D4

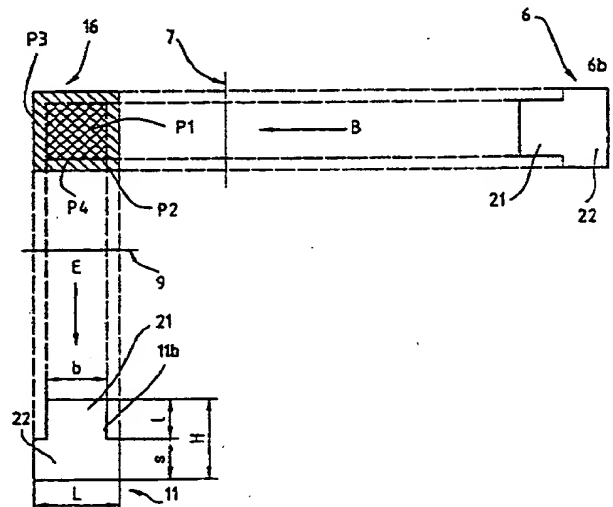
DE 196 28 156 A 1

71 Anmelder:
Palas GmbH Partikel- und Lasermeßtechnik, 76229
Karlsruhe, DE
74 Vertreter:
Lichti und Kollegen, 76227 Karlsruhe

72 Erfinder:
Mölter, Leander, 76744 Wörth, DE; Munzinger,
Friedrich, 75053 Gondelsheim, DE

54 Vorrichtung und Verfahren zum Messen eines Teilchenstromes in einem Fluid

57 Zur Vereinfachung der optischen Messung eines Teilchenstromes in einem Fluid und insbesondere zur Ausschaltung von Fehlern sieht die Erfindung bei einer Vorrichtung zur Messung eines Teilchenstromes in einem Fluid mit mindestens einer eine Blende aufweisenden Beleuchtungsanordnung und mit mindestens einer eine Blende aufweisenden Empfängeranordnung vor, daß mindestens eine Blende (6a, 11a) eine Blendenöffnung (6, 11) mit einem zum inneren der Blendenöffnung (8, 11) konvex ausgebildeten Rand (6b, 11b) aufweist. Bei einem Verfahren ist vorgesehen, daß der Teilchenstrom durch eine Blendenöffnung mit zu ihrem Inneren hin konvex ausgebildetem Rand beleuchtet und/oder betrachtet wird, daß die Maximalintensität des durch einen ersten optischen Meßbereich fliegenden Teilchens gemessen und das Teilchen nur berücksichtigt wird, wenn die Intensität beim Durchfliegen durch einen zweiten Meßbereich einen bestimmten Mindestprozentsatz der für dieses Teilchen gemessenen Maximalintensität überschreitet.



DE 196 28 156 A 1

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Messung eines Teilchenstroms in einem Fluid mit mindestens einer Blende aufweisenden Beleuchtungsanordnung und mit mindestens einer Blende aufweisenden Empfängeranordnung und ein Verfahren zum Messen eines Teilchenstroms in einem Fluid, wobei der Teilchenstrom beleuchtet und unter einem endlichen Winkel zur Beleuchtungsrichtung von Teilchen gestreutes Licht detektiert wird.

Bei einem zu messenden Teilchenstrom in einem Fluid kann es sich um Feststoff oder Flüssigkeitsteilchen in einem Gas oder in einer Flüssigkeit handeln. Derartige Messungen werden durchgeführt, um in der Regel die Teilchengrößenverteilung und die Teilchenkonzentration im Fluid zu bestimmen. Die Teilchengröße ist proportional zur von einem Teilchen auf einen Empfänger gestreuten Lichtintensität, die Konzentration wird über die Zählimpulse bestimmt. Insbesondere bei der Bestimmung der Teilchengröße kann es zu Fehlern kommen, wenn Teilchen, die teilweise sich im optischen Meßvolumen befinden, teilweise außerhalb desselben aus diesem Grunde auf den Empfänger nur eine geringere Lichtintensität streuen, als es ihrer Größe entspricht. Derartige Fehler müssen ausgeschlossen werden. Dies wurde bisher dadurch getan, daß das gestreute Licht durch zwei Detektoranordnungen mittels Koinzidenzmessungen erfaßt wurde, wobei die Detektoranordnungen Blendenöffnungen unterschiedlicher Größe aufwiesen. Hierdurch ist ein hoher apparativer Aufwand notwendig. Darüber hinaus kann eine solche Messung zu Fehlern führen, wenn die Teilchen nicht gleichmäßig streuen.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren anzugeben, mit denen unter Vermeidung der genannten Fehler genaue Messungen mit geringerem apparativem Aufwand erzielbar sind.

Erfindungsgemäß wird die genannte Aufgabe bei einer Vorrichtung der eingangs genannten Art dadurch gelöst, daß mindestens eine Blende eine Blendenöffnung mit einem zum Inneren der Blendenöffnung konvex ausgebildeten Rand aufweist. Ein erfindungsgemäßes Verfahren sieht zur Lösung der Aufgabe vor, daß der Teilchenstrom durch eine Blendenöffnung mit zu ihrem Inneren hin konvex ausgebildetem Rand beleuchtet und/oder betrachtet wird, daß die Maximalintensität des durch einen ersten optischen Meßbereich fliegenden Teilchens gemessen und das Teilchen nur berücksichtigt wird, wenn die Intensität beim Durchfliegen durch einen zweiten Meßbereich einen bestimmten Mindestprozentsatz der für dieses Teilchen gemessenen Maximalintensität überschreitet.

Durch die mit einem zum Inneren hin konvexen Rand versehene Blendenöffnung wird die Blende in zwei oder mehr Bereiche unterteilt, durch die bei der Abbildung der Blende in den Teilchenstrom unterschiedliche Meßbereiche definiert werden. Ein nahe dem Rand des breiteren Blendenbereichs bzw. breiteren Meßbereichs hindurchfliegendes Teilchen wird außerhalb des schmälere Blendenbereichs bzw. des hierdurch bedingten Meßbereichs bleiben und daher in diesem Bereich nicht mehr erfaßt werden. Der Streulichtimpuls eines solchen Teilchens wird eine geringere Zeitdauer haben als der eines mittig durch die Blende fliegenden Teilchens. Das erstgenannte Teilchen kann daher bei der Messung ausgeschlossen werden, was in der durch das genannte Ver-

fahren gekennzeichneten Weise geschieht.

Hierdurch können mit einer Empfängeranordnung (und einer Beleuchtungsanordnung) Randfehler ausgeschlossen werden und damit der apparative Aufwand zur fehlerfreien Messung eines Teilchenstroms in einem Fluid reduziert werden.

In einer bevorzugten Ausgestaltung ist vorgesehen, daß der Rand stufenförmig ausgebildet ist, wobei die Blendenöffnung T-förmig ausgebildet ist oder aber die Blendenöffnung H-förmig ausgebildet ist. Im erstgenannten Falle sehen Weiterbildungen vor, daß die Länge des T-Schenkels gleich der Stärke des T-Querstegs ist und daß der T-Schenkel in Strömungsrichtung des Teilchenstroms ausgerichtet ist. Im zweitgenannten Falle kann vorgesehen sein, daß die Länge des die H-Schenkel verbindenden H-Querstegs gleich der Stärke der H-Längsschenkel ist oder daß die Länge des die H-Schenkel verbindenden H-Querstegs gleich dem Doppelten der Stärke der H-Längsschenkel ist, wobei jeweils der H-Quersteg in Strömungsrichtung des Teilchenstroms ausgerichtet ist.

Weitere bevorzugte Ausbildungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung sehen vor, daß sowohl die Blendenöffnung der Abbildungsanordnung als auch die Blendenöffnung der Empfängeranordnung mit konvexen Rändern ausgebildet ist und daß eine Blende zwei Blendenöffnungen unterschiedlicher Abmessungen aufweist. Die Blendenöffnungen sollen scharfkantig und gratfrei ausgebildet sein.

Das erfindungsgemäße Verfahren sieht in Weiterbildung vor, daß als zweiter Meßwert die Teilchenintensität nach einem Zeitraum von etwa der mittleren Durchströmungszeit des Teilchens durch den ersten optischen Meßbereich nach der Feststellung der Maximalintensität bestimmt wird, wobei insbesondere lediglich Teilchen erfaßt werden, die bei Durchströmen durch den zweiten optischen Meßbereich eine relative Signalintensität von mindestens 20% der gemessenen Maximalintensität ergeben.

Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen und aus der nachfolgenden Beschreibung, in der Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Figuren im einzelnen erläutert sind.

Dabei zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung;

Fig. 2 die erfindungsgemäß eingesetzten Blenden und das durch diese optisch gebildete Meßvolumen in Projektion;

Fig. 3 das erfindungsgemäß gebildete Meßvolumen in perspektivischer Darstellung;

Fig. 4 Signalverläufe von mittels der erfindungsgemäßen Vorrichtung detektierten Teilchen;

Fig. 5a—5c andere Ausgestaltungen erfindungsgemäßer Blendenöffnungen;

Fig. 6 die Ausgestaltung einer erfindungsgemäßen Doppelblende; und

Fig. 7a—7c weitere Ausgestaltungen erfindungsgemäßer Blendenöffnungen.

Zur Messung eines Teilchenstroms in einem Fluid, wie zur Messung eines Aerosols, erfolgt eine Beleuchtung des Teilchenstroms durch eine Beleuchtungsanordnung 2 mit einer Lichtquelle 3, die vorzugsweise eine Quelle weißen Lichtes ist, einem Kondensorsystem 4, einer Blendenöffnung 6 in einer Blende 6a und einer Abbildungsoptik 7. Die Betrachtung des Teilchenstroms erfolgt über eine Empfängeranordnung 8 mit einer Abbildungsoptik 9 einer weiteren Blendenöffnung 11 in

einer weiteren Blende 11a, einem weiteren Kondensor-system 12 und einem optoelektrischen Empfänger 13. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist zur Parallelan-ordnung von Lichtquelle und Empfänger noch ein Um-lenkspiegel 10 vorgesehen, der aber nicht notwendig ist. Das vom Empfänger 13 gelieferte Signal wird in einer anschließenden Elektronik verarbeitet.

Die Abbildungsoptik 9 der Empfängeranordnung 8 ist derart, daß sie die Blendenöffnung 11 dorthin abbildet, wo die Abbildungsoptik 7 die Blendenöffnung 6 in den Teilchenstrom abbildet. Es wird damit optisch ein Meß-volumen 16 im Kreuzungsbereich des Beleuchtungs-strahlenganges 17 und des Empfängerstrahlenganges 18 innerhalb des Teilchenstromes gebildet.

Der Teilchenstrom fließt in der Regel senkrecht durch die durch die Beleuchtungs- und Empfängerstrah-lengänge 17, 18 gebildete Ebene, also in der Darstellung der Fig. 1 senkrecht zur Blattebene.

Erfindungsgemäß sind die Blendenöffnungen 6, 11 aber mit zum Inneren der Blendenöffnungen 6, 11 hin gerichteten konvexen Rändern bzw. Kanten ausgebil-det. Die Konvexität wird in allen dargestellten Ausführungsbeispielen durch Stufen oder Schultern der Um-randung der Blendenöffnung erreicht. Im dargestellten Ausführungsbeispiel bilden die Blendenöffnungen 6, 11 jeweils ein T, wie dies aus der Fig. 2 ersichtlich ist, wo zur Verdeutlichung die Blendenöffnungen 6, 11 aller-dings in die Strahlenebene 17, 18 umgeklappt bzw. projiziert sind. Die Beleuchtungsrichtung ist hier, wie auch in Fig. 3, mit B, die Empfangslichtstrahlrichtung mit E und die Teilchenströmung mit A bezeichnet.

Die T-förmigen Blendenöffnungen 6, 11 weisen einen T-Längsschenkel 21 und einen T-Quersteg 22 auf. Die Länge l des T-Längsschenkels stimmt im dargestellten Ausführungsbeispiel mit der Stärke s des T-Querstegs 22 überein. Die absoluten Gesamtabmessungen der Blendenöffnungen 6, 11 werden durch die Abbildungs-anordnung, das gewünschte Meßvolumen sowie die Ge-nauigkeit der Bearbeitungsmöglichkeit der Blenden und Blendenöffnungen bestimmt, da diese möglichst scharf-kantig und mit scharfen Ecken sowie gratfrei hergestellt werden sollten. Die linearen Gesamtabmessungen lie-gen beispielsweise etwa in der Größenordnung von 0,5 mm. In einem konkreten Ausführungsbeispiel be-trägt die Länge des T-Längsschenkels $l = 0,250$ mm, die Stärke des T-Querstegs ebenfalls $s = 0,250$ mm, die Ge-samthöhe der Blendenöffnungen 6, 11 damit $H = 0,5$ mm, die Breite des T-Längsschenkels ebenfalls $b = 0,500$ mm und die Länge des T-Querstegs $L = 0,650$ mm. Die Dicke des Blendenmaterials beträgt ca. 50 μ m.

Durch die beiden in der Fig. 2 dargestellten T-förmigen Blendenöffnungen 6, 11 wird das in der Fig. 3 darge-stellte Meßvolumen 16 optisch gebildet, das die Form eines quadratischen Pilzes hat und zwei in Strömungs-richtung A des Teilchenstroms 1 aufeinanderfolgende Meßbereiche 16a, 16b aufweist, die unterschiedliche Querschnittsflächen senkrecht zur Strömungsrichtung A des Teilchenstroms 1 haben (also mit parallel zu A gegebener Flächennormalen), im dargestellten Ausführungsbeispiel aber in Strömungsrichtung gleiche Höhen h entsprechend den übereinstimmenden Werten l und s der Blendenöffnungen 6, 11.

Fliegt nun ein Teilchen P1 auf einer Bahn, so daß es durch beide Meßbereiche 16a, 16b hindurchtritt (Fig. 2), so streut es von seiner Größe abhängige Lichtintensität sowohl während der Zeit t , während der es durch den Meßbereich 16a fliegt, als auch während der Zeit, wäh-

rend der es durch den Meßbereich 16b fliegt, und liefert damit im Empfänger 13 das in der Fig. 4 mit P1 bezeich-nete Signal, das über die gesamte Durchflugszeit $2t$ des Teilchens P1 durch das gesamte Meßvolumen 16 in etwa gleich groß ist.

Ein Teilchen P2, das in einem Randabschnitt des Meß-bereiches 16a durch diesen hindurchtritt, liefert nur während der Zeit t , während der es sich im Meßbereich 16a befindet, ein seiner Größe entsprechendes Signal, während es nach Austreten aus dem Meßbereich 16a nicht mehr durch den kleineren Meßbereich 16b, son-dern an diesem vorbei fliegt und daher auf dieses Teil-chen in der Flughöhe des Meßbereichs 16b kein Licht fällt, es damit auch kein Licht in den Empfänger 13 streuen kann, so daß es lediglich während der Zeit t ein Streulichtsignal P2' (Fig. 4) liefert.

Ein Teilchen P3, das bei seinem Weg durch das Meß-volumen 16 den Meßbereich 16b nur mit einem gerin-gen Bereich seines Volumens tangiert bzw. in diesen Bereich eintritt, während der Schwerpunkt des Teil-chens P3 außerhalb des Meßbereichs 16b liegt, wird damit auch nur auf seinem kleinen, in den Meßbereich 16b ragenden Oberflächenanteil beleuchtet und kann nur mit diesem geringen Anteil Licht in den Empfänger 13 streuen, so daß der Empfänger das gesamte, der Teil-chengröße entsprechende Signal nur beim Durchgang durch den ersten Meßbereich 16a über die Zeit t , nach-folgend aber ein wesentlich geringeres Signal enthält, wie es insgesamt mit P3' in der Fig. 4 dargestellt ist. Gegenüber dem durch die Teilchengröße bestimmten Maximalsignal während der Durchlaufzeit t (entspre-chend dem Meßbereich 16a) beträgt die Signalintensität beim Durchflug durch den Meßbereich 16b nur noch ca. 20%, wie der Fig. 4 zu entnehmen ist.

Ein Teilchen P4, das mit seinem größten Teil sowohl durch den Meßbereich 16a als auch durch den Meßbe-reich 16b fliegt, aber am Rande des letzteren derart, daß ein geringer Oberflächenanteil des Teilchens außerhalb des Meßbereichs 16b liegt, wird auch beim Durchfliegen des Meßbereichs 16b noch ein relativ großes Signal im Verhältnis zu dem durch seine Größe bestimmten Maxi-malsignal bewirken. Ein Signal eines solchen Teilchens ist in Fig. 4 mit P4' bezeichnet.

Um nun die Verfälschung der Meßergebnisse, insbe-sondere der Partikelgrößenverteilung durch Teilchen, die aufgrund des Umstands, daß ein Teil ihrer Oberflä-che außerhalb des Meßvolumens liegt, zu vermeiden, werden nur die Teilchen mit ihrer während der Zeit t (Durchflug durch den Meßbereich 16a) empfangenen Maximalintensität (100%) gezählt, die beim Hindurch-fliegen durch den Meßbereich 16b eine Signalintensität oberhalb einer vorzugebenden Schwelle, die im darge-stellten Ausführungsbeispiel der Fig. 4 mit 50% der Ma-ximallichtintensität angegeben ist, detektiert, während Teilchen, die während des Durchströmens durch den Meßbereich 16b eine geringere relative Signalintensität liefern, für die Messung verworfen werden. Im darge-stellten Ausführungsbeispiel werden zur Messung ledig-lich die Teilchen P1 und P4 herangezogen, während die Teilchen P2 und P3 verworfen werden.

Die Minimalschwelle S ist abhängig von der Teilchen-größe relativ zum Meßvolumen. Im dargestellten Aus-führungsbeispiel könnte die Schwelle S auch tiefer als 50% der jeweiligen Maximalintensität gelegt werden. Die Teilchen können aber Querschnittsabmessungen aufweisen, die abweichend von der Darstellung der Fig. 2 in der Größenordnung der Abmessungen des Meßvolumens liegen und beispielsweise nur ein Fünftel

bis ein Zehntel der Abmessungen des Meßvolumens betragen. In diesem Falle sind auf jeden Fall von der Zählung solche Teilchen auszuschließen, bei denen auch nur ein geringer Abschnitt über den Rand des Meßbereichs 16a herausragt.

Weitere bevorzugte Ausgestaltungen von erfindungsgemäßen Blenden sind in den Fig. 5 bis 7 dargestellt. Die Fig. 5a zeigt eine kreuzförmige Blendenöffnung. Die Fig. 5b zeigt eine H-förmige Blendenöffnung, wobei der die H-Schenkel 31, 32 verbindende H-Steg 33 in Erstreckungsrichtung A der Teilchenströmung ausgerichtet ist. Die Stärke S' der H-Schenkel 31, 32 entspricht der Länge l' des H-Stegs 33. Auch die Abb. 5c zeigt eine H-förmige Blendenöffnung. Hier entspricht allerdings die Länge l' des Stegs 33 dem Doppelten der Stärke S' der H-Schenkel 31, 32.

Die Fig. 6 zeigt in einer Blende 6a zwei in Strömungsrichtung A übereinander angeordnete T-förmige Blendenöffnungen 6', 6''. Hierdurch werden bei gleicher Abbildungsoptik (mit der beide Blendenöffnungen 6', 6'' in die Partikelströmung zur Bildung des Meßvolumens abgebildet werden) unterschiedlich große Meßvolumen gebildet, wodurch der Dynamikbereich, d. h. der Bereich der Konzentrationen, die mit einer entsprechenden erfindungsgemäß ausgebildeten Vorrichtung gemessen werden können, vergrößert werden kann.

Grundsätzlich kann der Materialsteg 34 zwischen den beiden Blendenöffnungen 6', 6'' auch fortgelassen werden, wodurch dann eine Blendenöffnung 6c entsprechend der Fig. 7a gebildet wird, während verschiedene Bereiche ebenfalls einerseits zum Ausscheiden unerwünschter Teilchen aus der Zählung und zum anderen zur Erhöhung des Dynamikbereiches genutzt werden können. Grundsätzlich kann die Blendenöffnung der Ausgestaltung der Fig. 7a auch in der Weise der Fig. 7b erfolgen, also die Blendenöffnung 6d ein H mit unterschiedlich langen Schenkeln 31, 32 bilden.

Ggf. kann die Vereinfachung der Blendenöffnung 6c auch zu der Blendenöffnung 6e geschehen, wie sie in Fig. 7c dargestellt ist. Hier werden bei geringen Teilchenkonzentrationen zur Messung die Blendenöffnungsbereiche 6e' und 6e'', bei hohen Teilchenkonzentrationen die Blendenöffnungsbereiche 6e'' und 6e''' zur Entscheidung darüber herangezogen, ob ein Teilchen zu zählen oder auszuschließen ist.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Messung eines Teilchenstroms in einem Fluid mit mindestens einer Blende aufweisenden Beleuchtungsanordnung und mit mindestens einer Blende aufweisenden Empfängeranordnung, **dadurch gekennzeichnet**, daß mindestens eine Blende (6a, 11a) eine Blendenöffnung (6, 11) mit einem zum Inneren der Blendenöffnung (6, 11) konvex ausgebildeten Rand (6b, 11b) aufweist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Rand (6b, 6c) stufenförmig ausgebildet ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Blendenöffnung (6, 11) T-förmig ausgebildet ist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Länge (l) des T-Schenkels (21) gleich der Stärke (s) des T-Querstegs (22) ist.
5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß der T-Schenkel (21) in Strömungsrichtung (A) des Teilchenstroms ausgerichtet ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Blendenöffnung (6, 11) H-förmig ausgebildet ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Länge des die H-Schenkel verbindenden H-Querstegs gleich der Stärke der H-Längsschenkel ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Länge des die H-Schenkel verbindenden H-Querstegs gleich dem Doppelten der Stärke der H-Längsschenkel ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sowohl die Blendenöffnung der Abbildungsanordnung (2) als auch die Blendenöffnung (11) der Empfängeranordnung (8) mit konvexen Rändern (6b, 11b) ausgebildet ist.

10. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Blende (6) zwei Blendenöffnungen (6', 6'') unterschiedlicher Abmessungen aufweist.

11. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Ränder (6b, 11b) der Blendenöffnungen scharfkantig sind.

12. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Ränder (6b, 11b) der Blendenöffnungen (6, 11) gratfrei sind.

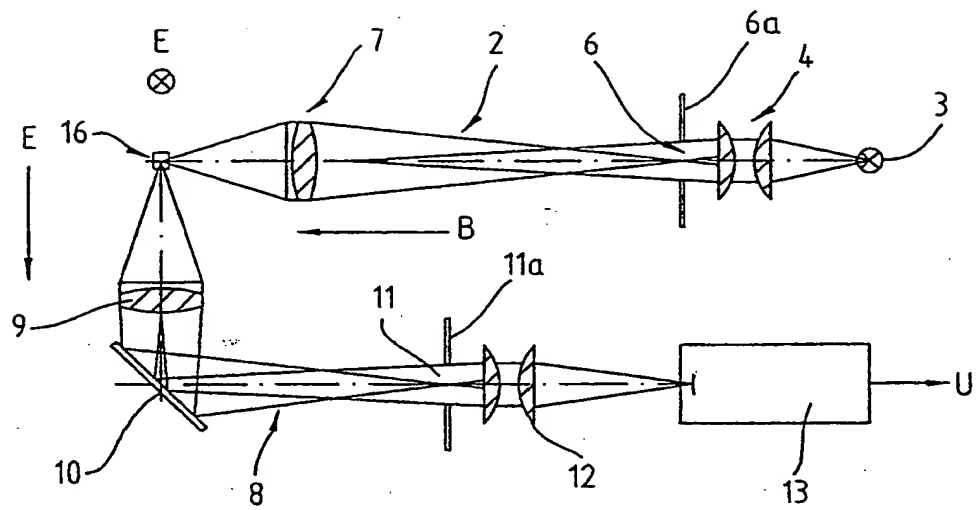
13. Verfahren zum Messen eines Teilchenstroms in einem Fluid, wobei der Teilchenstrom beleuchtet und unter einem endlichen Winkel zur Beleuchtungsrichtung von Teilchen gestreutes Licht detektiert wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Teilchenstrom durch eine Blendenöffnung mit zu ihrem Inneren hin konvex ausgebildetem Rand beleuchtet und/oder betrachtet wird, daß die Maximalintensität des durch einen ersten optischen Meßbereich fliegenden Teilchens gemessen und das Teilchen nur berücksichtigt wird, wenn die Intensität beim Durchfliegen durch einen zweiten Meßbereich einen bestimmten Mindestprozentsatz der für dieses Teilchen gemessenen Maximalintensität überschreitet.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß als zweiter Meßwert die Teilchenintensität nach einem Zeitraum von etwa der mittleren Durchströmungszeit des Teilchens durch den ersten optischen Meßbereich nach der Feststellung der Maximalintensität bestimmt wird.

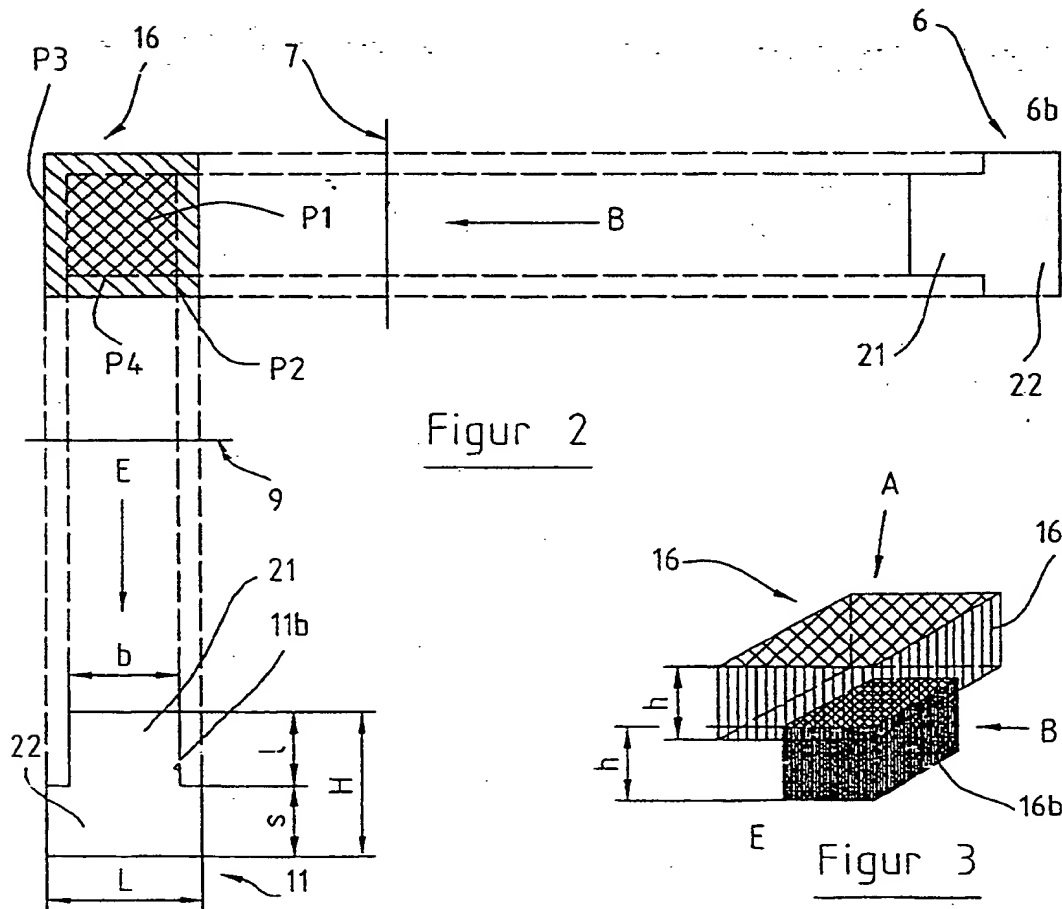
15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß lediglich Teilchen erfaßt werden, die bei Durchströmen durch den zweiten optischen Meßbereich eine relative Signalintensität von mindestens 20% der gemessenen Maximalintensität ergeben.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

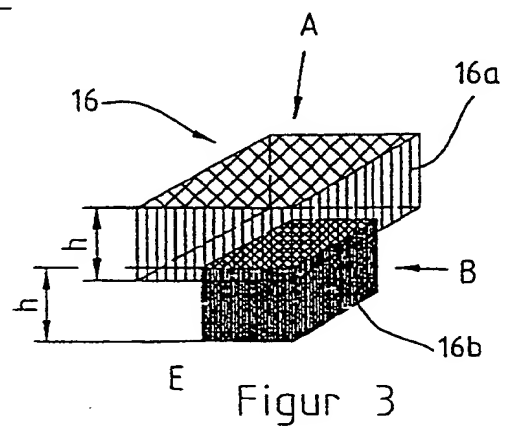
- Leerseite -



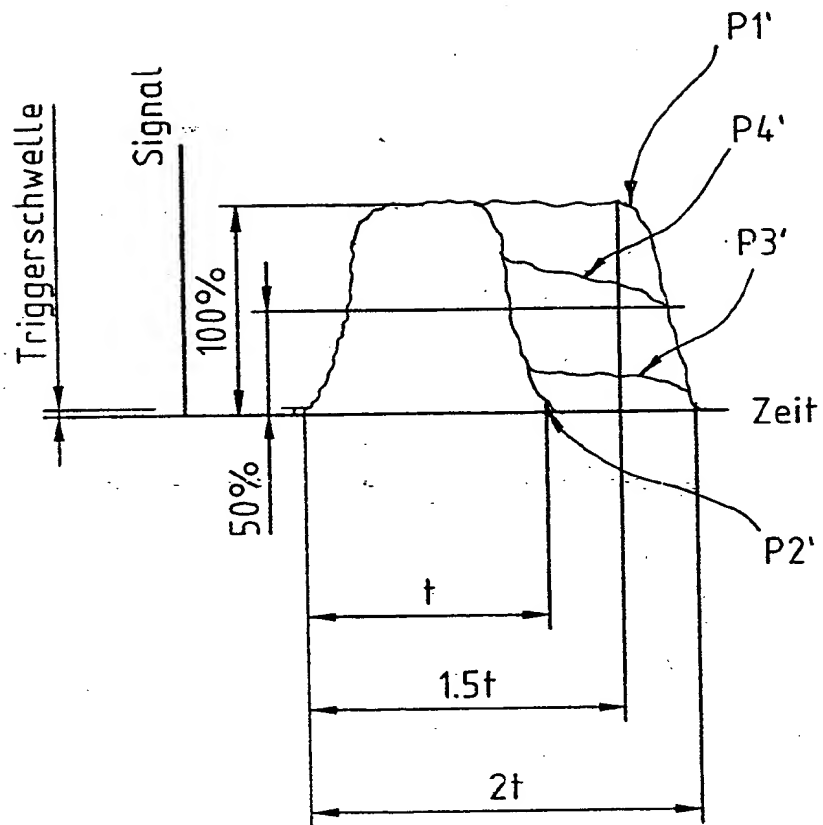
Figur 1



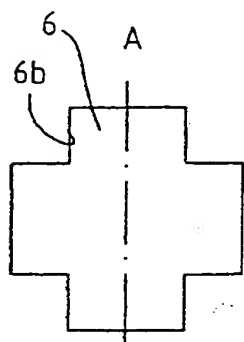
Figur 2



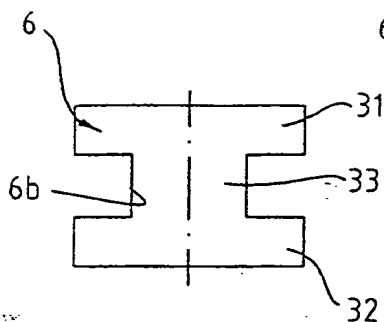
Figur 3



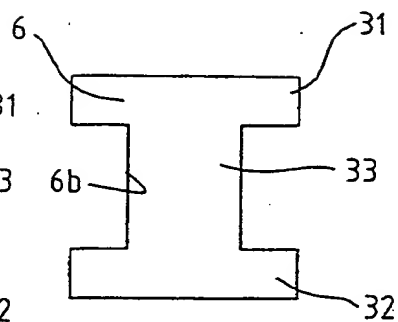
Figur 4



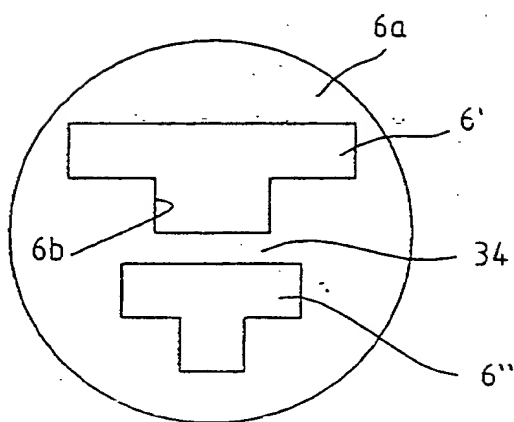
Figur 5a



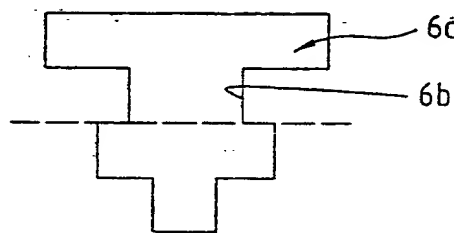
Figur 5b



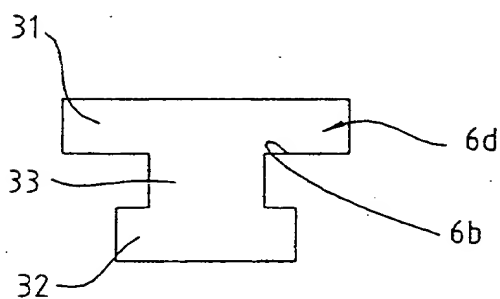
Figur 5c



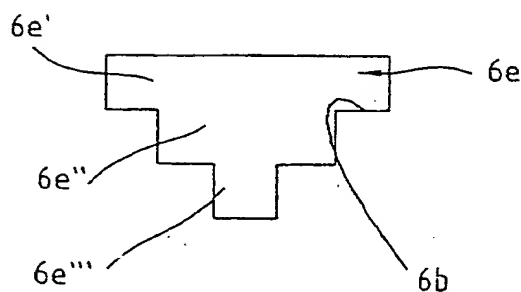
Figur 6



Figur 7a



Figur 7b



Figur 7c

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7 :

G01N 15/14

A2

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/45147

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

3. August 2000 (03.08.00)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00/00621

(22) Internationales Anmeldedatum: 26. Januar 2000 (26.01.00)

(30) Prioritätsdaten:

199 03 001.4 26. Januar 1999 (26.01.99) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten außer US): EVOTEC
BIOSYSTEMS AG [DE/DE]; Schnackenburgallee 114,
D-22525 Hamburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FUHR, Günter [DE/DE];
Kavalierstrasse 15, D-13187 Berlin (DE). SCHNELLE,
Thomas [DE/DE]; Koppenstrasse 65, D-10243 Berlin
(DE). REICHLER, Christoph [DE/DE]; Sprengelstrasse 20,
D-13353 Berlin (DE). GLASSER, Henning [DE/DE];
Boxhagener Strasse 38, D-10245 Berlin (DE). MÜLLER,
Torsten [DE/DE]; Hartriegelstrasse 39, D-12439 Berlin
(DE). GRADL, Gabriele [DE/DE]; Thomasiusstrasse 8,
D-10557 Berlin (DE).

(74) Anwalt: HERTZ, Oliver, V. Bezold & Sozien, Akademiestr.
7, D-80799 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE,
CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE).

Veröffentlicht

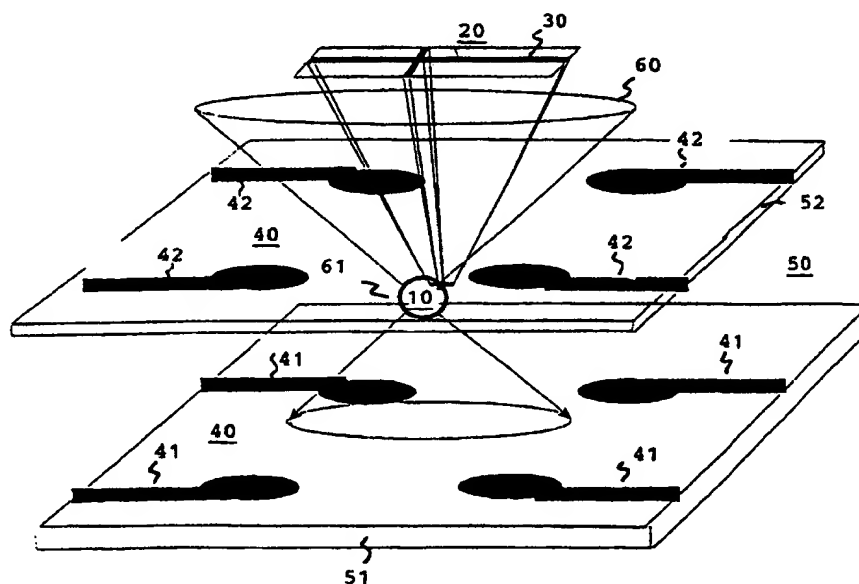
Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu
veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR DETECTING MICROSCOPIC OBJECTS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR DETEKTION MIKROSKOPISCH KLEINER OBJEKTE

(57) Abstract

The aim of the invention is to detect objects, especially in fluidic microsystems. At least one static or moving object (10) is represented on a structured mask (20) having at least one segment (30) which can transmit light from a planar partial area (80) to a detector. The object (10) is at least partially or temporarily located in said area (80) which has a characteristic dimension that is smaller than the dimension of the object (10) or the displacement path thereof. The amount of light transmitted by the structured mask (20) is detected. A detector signal which exists in a given context in relation to the amount of light is generated. The detector signal is evaluated with respect to the presence of the object (10), the position and shape thereof and/or a temporary modification in the position thereof.



(57) Zusammenfassung

Zur Objektdetektion erfolgen insbesondere in fluidischen Mikrosystemen eine optische Abbildung mindestens eines ruhenden oder bewegten Objekts (10) auf eine strukturierte Maske (20) mit mindestens einem Segment (30), das dazu eingerichtet ist, Licht von einem flächigen Teilbereich (80), in dem sich das Objekt (10) zumindest teil- oder zeitweise befindet und der eine charakteristische Dimension besitzt, die kleiner als die Dimension des Objekts (10) oder seiner Bewegungsbahn ist, zu einer Detektoreinrichtung zu übertragen, eine Detektion der von der strukturierten Maske (20) übertragenen Lichtmenge und Erzeugung eines Detektorsignals, das in einen vorbestimmten Zusammenhang mit der Lichtmenge steht, und eine Auswertung des Detektorsignals in Bezug auf das Vorhandensein des Objekts (10), seine Position, seine Form und/oder die zeitliche Änderung der Position.

